

(19) (KR)
(12) (A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
G01R 31/28

(11)
(43)

10-2004-0071214
2004 08 11

(21) 10-2004-7009457

(22) 2004 06 17

2004 06 17

(86) PCT/IB2002/005129

(87)

WO 2003/052437

(86) 2002 12 02

(87)

2003 06 26

(30) 10/023,537 2001 12 18 (US)

(71) -5621 1

(72) -5656 6

(74)

:

(54)

(ATE)
가

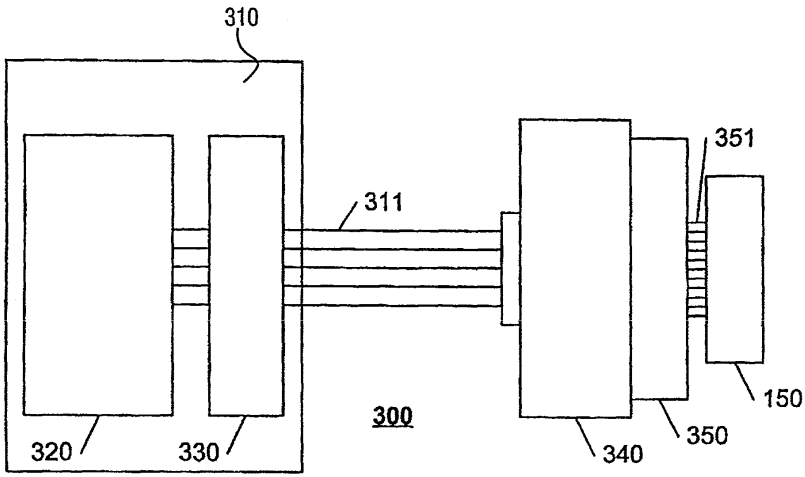
(DUT)

가

ATE

가

가



1 (ATE) (140) (DUT:150)
 (100) (100) (core test component:120) ATE(110) RF
 (130) 가 (130) (130) 1
 (150) (DFT) (100)
 가 ATE (110) ATE (110)
 가 (15) (stimuli) 가 ATE (110) (150) 가
 ATE (110) 가 ATE (110)
 ATE (110) 가 ATE (110)
 ATE (110) (150)
 가 (110) 가 (150) (111) (150) (mis-shaping)
 (100) 가 (111) (130), (111) (at device speed)
 (111) 가 (150) (111) (100)
 (150) (an observed anomalous behavior)

(signal slew and skew)

ATE

가

ATE

(130)

(150)

(130)

(130)

1998 8 11
E SAME' , 2

USP 5,793, 117, 'SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING TH
(100) (150)

(150)

(240)

(205)

(201)

(140)

(201)

(150)

(201)

1

(110)가
(202)

(150)

(LED:206)

(202)가

(150)

(202)가

(202) 가
(150)

(201)

(202)가 ATE

, ATE

가

(202)
(202)가

(150)

(ATE)

가

(DUT)

가

가

ATE

가

가

2 가 ,

3 가 ,

4 , 가

3 가 .

가 , (310)

(320) (150) (320)

(310) (311) 가 (PIC:350)

(330) 가 (310)

(340) 가 (350) (350) (310)

가 (350) (150)

(311) (310) (150) 가 (150) (350)

(310)

, ATE , ATE (150)

, ATE (150) 가

, 가 (350) , ATE가 (150) 가

, ATE(110)

가 가

```

Sub SetupTest (Register, A, B, min, max, increment)
  Initialize hold to default_hold
  For setup = max to min, step -increment
    Initialize Register[Value] to A
    Clear Register[Clock]
    Set Register[Data-input] to B
    Wait (setup)
    Trigger Register[Clock]
    Wait (hold)
    Get Register[Output]
    If (Register[Output]<>B) then return (setup+increment)
  Next set-up
  return (min)
Sub End

```

(core) A , B , ,
 , 가 , . , ,
 가 , (+ 가) ,
 가 , . ,
 6 .
 to B' 가 B가 가 , 'Set Register[Data-input]
 가 , Data-input , 'Trigger Register[Clock]' 가
 가 , , ,
 ATE , , , ,
 , (150) , 3 가 (350)
 , 가 ,
 (150)가 , ,
 , 가 , ,
 가 , 가
 , 가 (350) , ,
 , , , , , ,
 , (150) , , 가 (350)
 , ATE , , ,
 , 가 (350)가, , 'CALLP
 IC Subname(Args)' , ,

CALL SetupTest(Reg7,0,1,2,10,0.5)

가 (350)가 Reg7
 (350) 10 2
 , -0.5 Reg7 0 1
 가 (2) 가
 가 ATE
 가 (350) 가
 (350) , ATE(310)가 가
 가 (340)가 (150)
 , ATE(310) (350)
 , (ATE:310) 가 (350)
 0) (350)가 ATE(310) (formulate) 가 (35)
 , 가 (350) 가
 , 가 (350)
 , 가 (350)
 4 (150) 가 (350)
 (400) , (400)
 (410) (340) 가 (340)
 (311, 455) 가 (350) 4 가 (350)
 (340) 가 (150) 가 (350)
 (150) , 2001
 11 8 , Ivo Rutten 10/005,974 'PRECONDITIONING INTEGRA
 TED CIRCUIT FOR INTEGRATED CIRCUIT TESTING'(US018179)
 IC , ATE
 가 , 가 (350) 가
 , 가 (350) 가
 0) , 가 (350) (240) 가 (350) (470) (35)
 , 가 (470) (340) 가 (470)
 (410)가 (150) 가 (350)가 (410) (350)
 311) (310: 3)
 (470)
 5,793,117 , (470) 가
 (350) (460) , 2001 11 8 I
 vo Rutten 'CHIP-MOUNTED CONTACT SPRINGS', 10/005,689 (:US01
 8180) , , 'V' , 4
 , 'V' , 2 , 'V' (150) (240)

50) . 2 V (410) (240) (150) (a resilient structure) (1

ATE 가 (built-in-self-test: BIST)' 가
, ATE 가 BIST ATE , BIST
, BIST 가 가 (350)
, BIST 가 가 (350)

(57)

1.

가

가

가

2.

1

가

3.

2

structure)가

(a resilient

4.

3

가

2

5.

1

가 , ,

6.

1 , 가 가 , 가

7.

6 , 가 가 , 가

8.

1 , 1 가 1 2

9.

1 ,

10.

1 , (a subroutine call) , 가

11.

, , 가 ,

11 12. ,

가

12 13. ,

가 2

11 14. ,

가

11 15. ,

가

15 16. ,

가

가

17. 가

가

가

18.

17

가 가

가 가 가 가

